

用于测量中微子静止质量的静电 减速谱仪的研究*

阎辰 赵裕民 孙汉城

(中国原子能科学研究院, 北京)

杨长根 唐孝威

(中国科学院高能物理研究所, 北京)

摘要

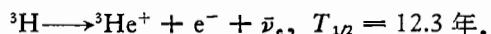
本文提出一种从氚衰变 β 谱确定电子反冲中微子静止质量的新型结构 β 谱仪。球面栅静电减速谱仪具有后聚焦系统。预计电子能量分辨率好于5 eV, 最大亮度为 0.26 cm^2 。

引言

泡利于1933年提出 β 衰变伴随发射中微子的假说, 成功地解释了 β 谱的连续分布^[1], 且已为实验证实^[2]。但是, 中微子的一些性质至今并未搞清, 其中中微子质量问题更为引人注目。

尽管有许多方法可用于测量中微子质量, 但是目前主要方法还是测量氚衰变的 β 能谱, 原因是氚 β 谱具有较低的端点能量及相对简单的初始与终止原子态。

氚的 β 衰变为:



β 谱正比于统计因数与费米函数, 统计因数又正比于跃迁能量 E_0 处的态密度:

$$dn/dE_0 = \text{const } p_e^2 p_\nu^2 (dp_\nu/dE_0) dp_e,$$

此处 p_e 与 p_ν 分别是电子与中微子的动量。考虑库仑修正后, 费米函数可写为:

$$F(E) = \chi(1.002037 - 0.00013086/\chi)/(1 - \exp(-\chi)),$$

其中 $\chi = 4\pi\alpha/\beta$, α 是精细结构常数。由能量守恒 $E_0 = E + E_\nu$ 即可得到 β 谱:

$$N(E) = \text{const } F(E) W p_e (E_0 - E)^2 \sqrt{1 - \left(\frac{m_\nu c^2}{E_0 - E}\right)^2},$$

其中 $W = E + m_0 c^2$ 是电子总能量。由测量近端点区的谱形即可得到中微子质量 m_ν 的信息。图1中分别给出质量为零与质量为35 eV的谱形, 图中右上角是放大2500倍的近端点 β 谱。

* 本工作是中国科学院科学基金资助课题。

本文1986年5月10日收到, 1987年7月28日收到修改稿。

为测准 β 谱求出 m_ν , 谱仪的性能应该是: 能量分辨率高, 亮度大, 本底低和畸变小。

目前, 各实验室测氚 β 谱仪大多是双聚焦(有铁或无铁)或螺旋 β 谱仪, 使用静电补偿大面积氚源以增大亮度^[3], 分辨率通常为几十 eV。瑞士用减速法使螺旋形 β 谱仪分辨率达 10 eV^[4], 日本双聚焦 β 谱仪也达 10 eV^[5]。

据国内外现况, 为进一步提高谱仪性能, 我们设计了下述静电减速谱仪。国外也有类似的设计^[6], 但各具特色。

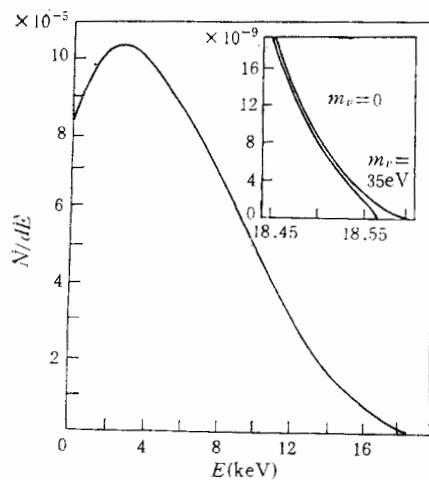


图 1 $m_\nu = 0$ 与 $m_\nu = 35$ eV 的氚衰变 β 谱
右上角为近端点的 2500 倍放大图

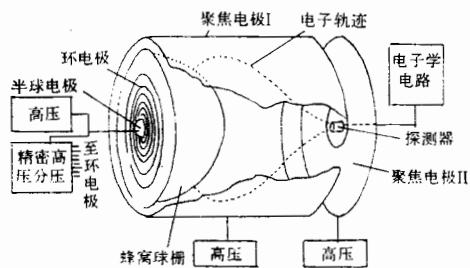


图 2 球栅减速静电积分谱仪结构示意图

谱 仪 设 计

图 2 是谱仪示意图, 整个装置圆筒轴对称。氚源位于半球形减速栅的球心, 源半径 0.53 cm, 球面减速栅半径 53 cm。在相当于球面栅过源点的大圆平面上, 有一组由同心环电极组成的电场成形环。减速电压经精密分压后, 按同心球壳电容器的电位分布馈电给每个成形环, 从而保证此减速场分布与理论计算值一致。由于在源心附近电场极强, 故采用反向半球壳代替成形环。球面分析栅的有效球面角为 45°—60°。从源出发, 进入减速电场区的电子能量高于减速电压者能够通过分析栅, 由后聚焦电极 I, II 会聚到电子灵敏探测器上; 能量低于减速电场者不能通过分析栅。源到探测器的直线距离为 1200 mm。聚焦后的电子束集中在探测器平面上半径为 2 cm 的范围内。分析栅及后聚焦电极由独立的电源分别供电。电极 I 为金属网, 它使能量很高而不能会聚到探测器上的电子穿过, 再由外壳吸收, 改善了聚焦条件并降低了本底。

设计中, 为保证谱仪的高性能, 对谱仪各部分有如下规定: 几何上保证同心电容器减速过程中的几何分辨好于 10^{-4} ; 分析栅固有分辨好于 10^{-4} ; 高压电源长期稳定性对分辨的影响好于 10^{-4} ; 系统内泄漏地磁场对电子轨迹扰动引起分辨恶化好于 10^{-4} , 从而使整体谱仪分辨好于 2×10^{-4} , 即好于 5 eV。

减速积分法分析电子能量属于高通滤波测量, 配以后聚焦系统, 故可采用大立体角工作状态。亮度定义为 $L = S\Omega/4\pi$, S 是谱仪系统内氚源有效面积, Ω 是谱仪探测电子的立体角也即透射率。预计本谱仪亮度达 0.26cm^2 , 为通常谱仪的数十倍。若由 β 谱端点逆推 100eV 为中微子质量灵敏区, 计数道宽 5eV , 则有效计数率约为 $0.1/\text{道}\cdot\text{s}$ 。

整套系统全部采用静电分析与静电聚焦, 从而结构简单, 各部件加工与装配误差对分辨率的影响都是二次间接影响, 加工工艺简单。

减速栅的几何分辨与本征分辨

由于源是有限的球面源而非点源, 其电子在同心球壳电容器减速场内运动的轨迹并非沿电力线方向, 而是在减速场中做椭圆运动, 其远日点距离小于或等于减速栅半径时, 电子不能通过栅网。由理论计算, 球栅的几何分辨率为 $\Delta E/E = (a/b)^2$, 其中 a 是源球面半径, b 是减速栅球面半径。对本谱仪, 几何分辨为 10^{-4} 。此外, 栅网附近电场等位面受到减速栅孔的影响而使其电场分布呈调制状, 从而必须考虑栅网自身的本征分辨。

对于均匀栅网, 限制能量分辨的主要因素, 是近栅网区的“洗衣板状”的电位起伏, 即栅网等位线的渗透与由此引起的电子轨迹的偏斜。若采用互相平行的双层栅, 可使分辨改善一个量级^[7], 但本谱仪要求大尺度栅网的情况下, 无论单栅或双层栅, 技术上都很难实现。为解决大尺度、高分辨分析栅问题, 本工作提出一种新的特殊栅网——蜂窝结构分析栅。图3给出单栅, 双层栅和蜂窝结构分析栅的二维电场模拟计算电位分布, 其结果与用电阻纸模拟实测的电位分布一致^[8]。结果表明, 使用边长 3mm 的大网孔蜂窝结构, 能够得到与 $2\text{线}/\text{mm}$ 的精密双层栅相似的电位分布。

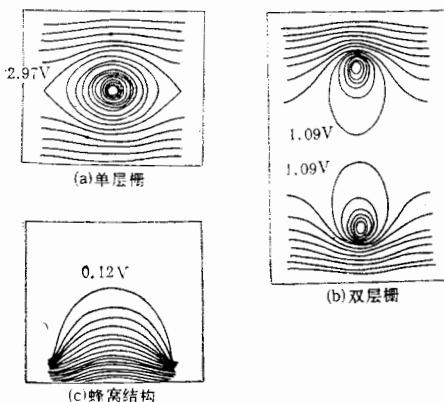


图3 不同结构栅网归一尺度下的二维电位分布对比
a. 单层栅; b. 双层栅; c. 蜂窝结构



图4 通过蜂窝结构分析栅的电子注荧光照片

计算表明, 不同厚度的蜂窝结构(平均孔径 6mm), 对单能平行入射的电子, 本征分辨

都好于 0.2 eV，且与单能电子能量无关。

我们曾对蜂窝结构栅和 2 线/mm 双层铜栅网用 1—6 keV 单能平行电子束进行分辨测量，两者结果相近^[9]。

使用蜂窝栅作分析栅不仅可获得大面积高分辨球面栅，而且，由于蜂窝栅孔本身是筒状静电透镜，电子通过时自动向孔轴线上会聚，减少了电子碰到孔壁而产生本底的可能性。图 4 是近似平行电子束通过蜂窝栅后在荧光屏上的成象，可清晰看到电子束的会聚现象。

蜂窝栅是用纯铝箔制成。

高通电子的后聚焦系统

后聚焦系统的作用，既是聚焦又是单色器。它仅把刚刚能通过分析栅的极慢速电子聚集到探测器上；而通过分析栅的高速电子则聚集到筒状电极上而被吸收，从而使高通型谱仪成为带通型谱仪，有效地降低了冲击噪声并提高了信噪比。

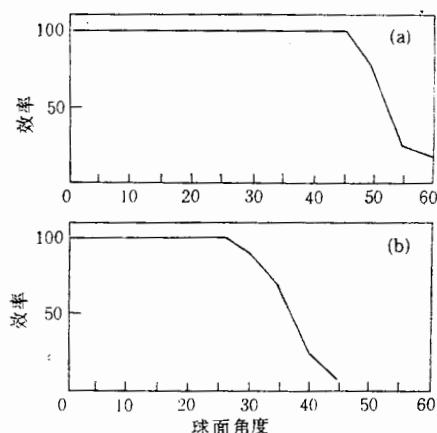


图 5 不同能量范围电子对分析栅球面张角通过响应的计算机模拟图。

(a) $E = 0 - 50 \text{ eV}$; $V_1 = -30000 \text{ V}$;
 $V_2 = -29958 \text{ V}$; $V_g = -29988 \text{ V}$;
(b) $E = 0 - 100 \text{ eV}$; $V_1 = -29005 \text{ V}$;
 $V_2 = -29050 \text{ V}$; $V_g = -29000 \text{ V}$

最大波动 $5 \times 10^{-7} \text{ T}$ 。计算得出谱仪内允许杂散磁场强度为 $B_{\max} \leqslant 3.7 \times 10^{-6} \text{ T}$ 。

用二维静磁计算程序 DE2D^[10] 对直径为 1m 的 PB 与 PC 两种 μ 金属屏蔽筒进行计算，结果如下表：

屏蔽材料及厚度 (mm)	45 PB		78 PC	
	1	2	1	2
筒内最大磁场 (10^{-7} T)	191	40	12	10

小 结

与目前各实验室运行的低能电子谱仪相比，本工作方案有高分辨、高亮度、效率可准确刻度及结构简单加工方便等特点。我们希望本工作方案会有助于中微子静止质量的研究。

胡济民、何祚庥、黄胜年、张焕乔等同志参加了本工作的讨论并提出了有价值的建议，在此向他们致谢。

参 考 文 献

- [1] W. Pauli Solvay Congress, Brussels, p. 234(1933) (Gauthier-Villars, Paris, 1934).
- [2] J. S. Allen, *Phys. Rev.*, 61(1942), 692.
- [3] V. S. Kozik et al, *Yad. Fiz.*, 32(1980), 309.
Phys. Lett., 94B(1980), 266.
- [4] R. Roberson et al, Proc. Intern. Conf. Neutrino, Vol. 1(1982), 51(Balatonfurod, Budapest, 1982), W. Kundig et al, *Massive Neutrinos in Astrophysics and Particle Physics*, (1984), 261. Ed. J. Tran Thanh Van.
- [5] H. Kawakami et al., INS-REP-561, Nov. (1985).
- [6] O. Fackler p. 17, UCRL-93808, Preprint (1985).
- [7] N. J. Taylor, *Rev. Sci. Instru.*, 40(1969), 792.
- [8] 赵振鲁等人，原子能科学研究院内部资料。
- [9] 阎辰等人，原子能科学技术，2(1988), 129.
- [10] Fan Mingwu et al., IEEE trans. Mag-21, (1985).

THE STUDY OF AN ELECTROSTATIC SPHERICAL GRID RETARDING SPECTROMETER FOR THE STUDY OF NEUTRINO REST MASS BY MEASURING BETA SPECTRUM FROM TRITIUM DECAY

YAN CHEN ZHAO YUMIN SUN HANCHENG

(Institute of Atomic Energy, Beijing)

YANG CHANGGEN TANG XIAOWEI

(Institute of High Energy Physics, Academia Sinica, Beijing)

ABSTRACT

A method is described for measuring the beta spectrum from tritium decay in order to determine the electron-antineutrino rest mass. This method includes an electrostatic spherical grid retarding spectrometer with a post focusing system. The resultant energy resolution will be better than 5 eV and a maximum luminosity of 0.26 cm² is expected.